Київський національний університет імені Тараса Шевченка Фізичний факультет Основи електроніки

ЗВІТ ПО ЛАБОРАТОРНІЙ РОБОТІ №3

Напівпровідникові діоди

Роботу виконала
Гордєєва Софія
студентка 2 курсу
5-Б групи
Фізичного факультету
Київського національного
університету
імені Тараса Шевченка

3MICT

ВСТУП

- 1. Мета роботи
- 2. Методи вимірювання

РОЗДІЛ 1. Теоретичні відомості

РОЗДІЛ 2 Практична частина

- 2.1. Вступ до практичної частини
- 2.2. Діод
- 2.3. Стабілітрон
- 2.4. Світлодіод

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

1. Мета роботи

Навчитися одержувати зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, дослідити властивості p-n—переходів напівпровідникових діодів різних типів.

2. Метод вимірювання

В роботі використовуються:

- 1) одержання зображення BAX діодів на екрані двоканального осцилографа, який працює в режимі характериографа;
- 2) побудова ВАХ діодів шляхом вимірювання певної кількості значень сили струму ІД, що відповідають певним значенням та полярності напруги UД, і подання результатів вимірів у вигляді графіка.

РОЗДІЛ 1.

Теоретичні відомості

1. <u>Напівпровідники п- та р-типу. Основні та неосновні носії заряду в</u> таких напівпровідниках.

Напівпровідник р-типу — напівпровідник, в якому основними носіями заряду є дірки. Напівпровідники р-типу отримують методом легування власних напівпровідників акцепторами. Напівпровідник n-типу — напівпровідник, в якому основні носії заряду — електрони провідності. Для того, щоб отримати напівпровідник n-типу, власний напівпровідник легують донорами.

В напівпровідниках розрізняють основні носії заряду й неосновні носії заряду. В напівпровідниках п-типу основними носіями заряду ϵ електрони провідності, а дірки ϵ неосновним носіями заряду. В напівпровідниках р-типу основними носіями заряду ϵ дірки, а електрони — неосновними.

2. р-п перехід. Власне електричне поле переходу. Контактна різниця потенціалів. Дифузійний та дрейфовий струми.

Розглянемо роботу р-п-переходу, утвореного на межі поділу двох середовищ, які являють собою один і той же напівпровідник, в одну з частин якого введені донорні домішки і яка відповідно має провідність п-типу (тобто перше середовище — це матеріал п-типу), а в іншу введені акцепторні домішки і яка мас провідність р-типу (друге середовище матеріал р-типу). Концентрація вільних електронів в матеріалі п-типу набагато більша, ніж концентрація вільних дірок.

Якщо матеріал типу привести в контакт з матеріалом р-типу, то почнеться процес дифузії електронів з матеріалу п-типу (де їх концентрація велика) в матеріал р-типу (де іх концентрація мала). Аналогічно, дірки будуть дифундувати з матеріалу р-типу (де іх концентрація велика) в матеріал птипу (де їх концентрація мала). Зрозуміло, що при двох вищезгаданих процесах матеріал п-типу буде втрачати негативний заряд і набувати позитивного

заряду, а матеріал р-типу, навпаки, буде втрачати позитивний заряд і набувати негативного заряду. В результаті в області контакту буде виникати електричне поле, яке буде протидіяти подальшому переходу електронів в р-область та дірок в п-область, і між матеріалом п-типу і матеріалом р-типу виникатиме різниця потенціалів. Ця різниця потенціалів називається контактною різницею потенціалів φ_k , а вищезгадане електричне поле — полем р-п-переходу E_{p-n}

3. <u>Пряме та зворотне включення p-n перехіду. Рух основних та неосновних</u> носіїв через p-n перехід під дією прямої та зворотної напруги.

Якщо до такої структури прикласти зовнішнє електричне поле (напругу), то в колі виникне струм, який залежатиме як від полярності прикладеної напруги, так і від її величини. Залежність струму крізь діод від прикладеної до нього напруги у достатньо гарному наближенні можна описати формулою:

$$I = I_0 \left[exp \left(\frac{eU}{kT} \right) - 1 \right]$$

де I — сила струму крізь p-n-перехід, е — елементарний електричний заряд, U — прикладена напруга, k — стала Больцмана, T — температура, I_o — стала величина, яка не залежить від напруги.

Таким чином, якщо напругу прикладено так, що більший потенціал відповідає р-області, а менший п-області діода (така напруга називається прямою або прикладеною у прямому напрямі), то буде спостерігатися експоненційна залежність струму І від прикладеної напруги U. Це зростання зумовлене збільшенням величини струму основних носіїв за рахунок зменшення потенціального бар'єру прикладеним до р-п-переходу зовнішнім електричним полем. При прикладанні до р≈п-переходу напруги зворотної полярності (таку напругу називають зворотною або прикладеною у зворотному напрямі) показник експоненти стає від'ємним і при достатньо великих абсолютних величинах цієї напруги ескпоненційним членом в дужках можна знехтувати порівняно з одиницею. Струм при цьому змінює знак (напрям протікання) і перестає залежати від величини U. Отже, струм І₀— це зворотний струм неосновних носіїв заряду. Величина цього зворотного струму

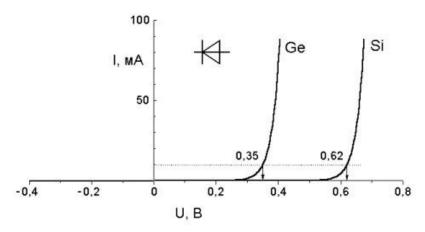
 ϵ невеликою порівняно з величиною прямого струму і залежить від температури та ширини забороненої зони напівпровідника, яка, у свою чергу, визначає висоту енергетичного бар'єру.

4. <u>Вольт-амперна характеристика (ВАХ) випрямлювального діода,її залежність від температури. Застосування випрямлю вальних діодів в</u> техніці.

Графік вольт-амперної характеристики (BAX) діода, що описується рівнянням

$$I = I_0 \left[exp \left(\frac{eU}{kT} \right) - 1 \right]$$

подано на рисунку:

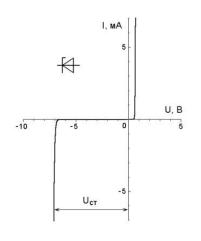


Діоди, що мають таку ВАХ, називають випромінювальними.

Їх використовують у пристроях випрямлення, обмеження, детектування. Найпотужніші з них здатні працювати при значеннях прямого струму до кількох тисяч ампер і витримувати без пробою зворотні напруги в десятки кіловольт.

5. <u>Оборотний та необоротний електричний пробій р-п перехіду. ВАХ</u> стабілітрона. Застосування стабілітрона.

При великих зворотних напругах p-n-переході "пробивається" і крізь нього протікає дуже великий струм. Існує три основних механізми пробою: теплова теплова нестійкість, тунельний ефект і лавинне розмноження. Пробій є відновлюваним, доки теплова потужність, розсіювана на p-n-переході, не перевищує припустимої, при якій відбувається його руйнування. Ця ділянка

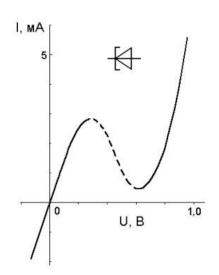


ВАХ (див. рисунок) використовується на практиці в пристроях стабілізації напруги, а діоди, що мають таку ділянку, називають *стабілітронами*. Напругу пробою можна регулювати технологічно (як правило, варіюванням концентрації домішок в р- і побластях) в широких межах — від одиниць до сотень вольт.

6. <u>Тунельний ефект. Енергетична діаграма та ВАХ тунельного діода.</u> Застосування тунельних діодів.

Тунелювання або тунельний ефект — фізичне явище, яке полягає в тому, що фізичний об'єкт долає потенційний бар'єр, величина якого більша від його кінетичної енергії. Найвідомішим прикладом явища є альфа-розпад. Це явище існує завдяки хвильовій природі квантових процесів, але проявляється не лише у квантових системах. Приклади тунелювання можна спостерігання і в оптиці, де процеси також описуються хвильовими рівняннями.

Якщо виготовити р-п-перехід з сильнолегованого напівпровідника, то



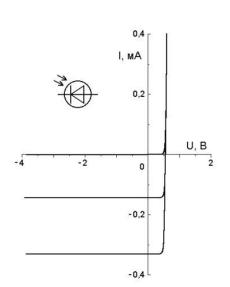
перехід ста€тонким і тунельні явища будуть проявляються і на прямій гілці BAX. Крива, зображена на рисунку, й ілюструє таку ситуацію. На прямій гілці виникає ділянка 3 від'ємним диференціальним опором. діоди називаються тунельними й використовуються при створенні

швидкодіючих тригерів і генераторів. Принцип дії тунельного діода добре описаний у багатьох підручниках.

7. <u>Випромінювальна рекомбінація носіїв заряду в напівпровідниках.</u> Принцип роботи і застосування світлодіодів.

У будь-якому прямозміщеному (включеному в прямому напрямку) р-ппереході при протіканні струму має місце рекомбінація носіїв заряду, в тому числі й випромінювальна, тобто з народженям фотонів. Випромінювально рекомбінує лише частина носіїв. І лише частина фотонів, уникнувши поглинання в самому діоді, зможе вийти назовні. Для створення практично придатного світловипромінювального діода (світлодіода) необхідні матеріали випромінювальної рекомбінації. високою імовірністю Якшо ДЛЯ випрямлювальних діодів використовуються переважно германій Ge і кремній Si, то матеріалом для світлодіодів ϵ арсенід галію GaA s, фосфід галію GaP i потрійні напівпровідникові сполуки на їх основі, а також карбід кремнію SiC. Оскільки енергія фотонів випромінювання (колір свічення) близька до ширини забороненої напівпровідника, перелічених зони ТО основі на напівпровідникових матеріалів вдалося створити світлодіоди, ЩО випромінюють у всій видимій та ближній інфрачервоній областях спектра.

8. Внутрішній фотоефект у напівпровідниках. Принцип роботи і застосування фотодіодів. Сонячні батареї.



Будь-якого носія заряду, електрона чи дірку, народженого в області дії поля контактної різниці потенціалів, буде відразу підхоплено цим електричним полем і виштовхнуто: електрона — в побласть, дірку — в р-область. Якщо такі електрон і дірка виникли під дією кванта світла з енергією, більшою за ширину забороненої зони, то з ними відбудеться

теж саме. На цьому ґрунтується принцип дії фотодіода, тобто пристрою, що здійснює пряме перетворення енергії оптичного випромінювання в електричну.

РОЗДІЛ 2

Практична частина

2.1. Вступ до практичної частини

Спочатку ми досліджуємо діод, потім стабілітрон, і на залишок світлодіод

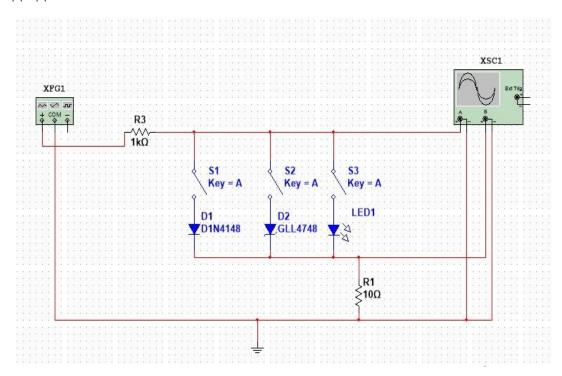
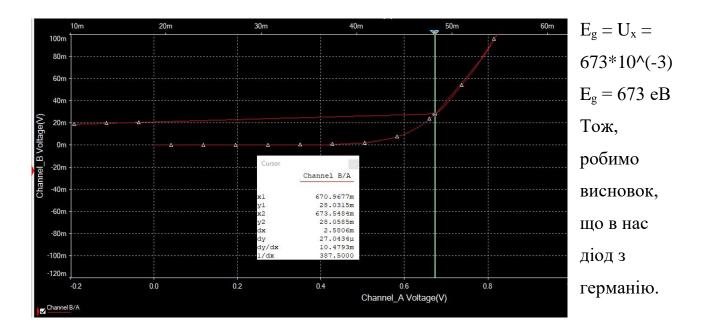


Рис.1 Схема для спостереження на екрані осцилографа вольт-амперних характеристик діодів.

2.2. Діод



Рис.2 BAX випромінювального діода



2.3. Стабілітрон

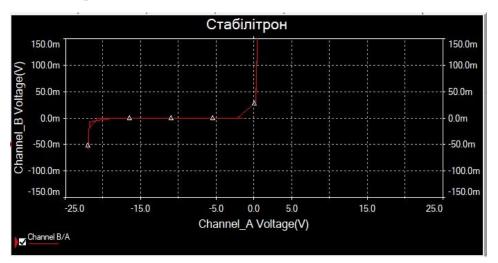
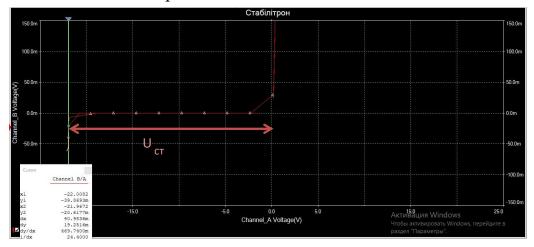


Рис.4 ВАХ стабілітрон



Тоді можемо порахувати напругу стабілізації:

$$UcT = 22*50*10 ^(-3) = 1.1B$$

2.4. Світлодіод

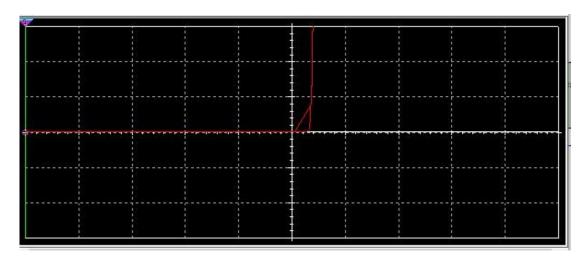
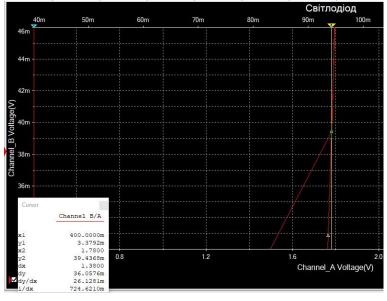


Рис.5 BAX світлодіоду



$${
m E_g} = {
m U_x}{
m e}$$
 ${
m E_g} = h {\lambda \over c} = 664$ нм, що відповідає червоному світлу

ВИСНОВОК

У ході даної лабораторної роботи ми навчилися одержувати зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, що можна побачити на рис.2, рис.4 і рис.5, дослідили властивості р-п-переходів напівпровідникових діодів різних типів. Виміряли ширину забороненої зони для випромінювального діода, та з'ясували, що він зроблений з германію. Також дізналися, що напруга стабілізації для досліджуваного стабілітрона становить 1.1В. Для світлодіода виміряли довжину хвилі, яка становить 664 нм, що відповідає червоному світлу (як і повинно було бути).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1. Ю.О. Мягченко, Ю.М. Дулич, А.В.Хачатрян "Вивчення радіоелектронних схем методом комп'ютерного моделювання" : Методичне видання. К.: 2006.- с.
- 2. Методичні вказівки до практикуму «Основи радіоелектроніки» для студентів фізичного факультету / Упоряд. О.В.Слободянюк, Ю.О.Мягченко, В.М.Кравченко.- К.: Поліграфічний центр «Принт лайн», 2007.- 120 с.